

RESUMEN**FRACTOGRAFÍA ELECTRÓNICA : SU CONTRIBUCIÓN AL ANÁLISIS DE FALLAS**

M.Ipohorski (*)

El objetivo del presente trabajo es resumir brevemente la contribución de la fractografía electrónica al análisis de fallas. Las micrografías electrónicas de barrido permiten observar las superficies de fractura a altas magnificaciones, son actualmente disponibles en todo laboratorio de materiales, y constituyen una herramienta muy valiosa para científicos e ingenieros de la ciencia de los materiales. Se describen las principales características de las superficies de fractura dúctil, frágil e intergranular, tal como se observan en un microscopio electrónico de barrido. Se analiza también la contribución de la fractografía electrónica al estudio de superficies de fatiga.

ABSTRACT**CONTRIBUTION OF ELECTRON FRACTOGRAPHY TECHNIQUES TO FAILURE ANALYSIS**

The aim of the present work is to give a brief overview of the contribution of electron fractography to failure analysis. Scanning electron micrographs involving higher magnification observations of the fracture surface, currently available in a research laboratory, make these techniques an useful tool to scientists and materials science engineers. Main characteristics of ductile, brittle and intergranular fracture surfaces, as observed in the scanning electron microscope, are described. The contribution of electron fractography to the study of fatigue surfaces is also analysed.

(*) Departamento Materiales, Laboratorio de Microscopía Electrónica, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica.